

УДК 620.22-022.532:620.3(075)  
ББК 30.377+30.600.3я73  
Б68

Рецензенты:

*В. И. Струнин*, д. ф.-м. н., профессор, зав. каф. экспериментальной физики  
и радиофизики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского;

*А. А. Теплоухов*, к. т. н., гл. энергетик завода металлоконструкций  
ООО НПО «Мостовик»

**Блесман, А. И.**

Б68 Теоретические основы методов исследования наноматериалов : учеб.  
пособие / А. И. Блесман, В. В. Даньшина, Д. А. Полонянкин ; Мин-  
обрнауки России, ОмГТУ. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017.

ISBN 978-5-8149-2506-0

Представлены теоретические основы методов исследования наноматериалов – растровой электронной микроскопии и рентгеновской дифрактометрии. Изложены рекомендации по выполнению заданий в ходе учебной, производственной и преддипломной практики.

Учебное пособие адресовано обучающимся по направлениям 28.03.02, 28.04.02 «Наноинженерия».

УДК 620.22-022.532:620.3(075)  
ББК 30.377+30.600.3я73

*Рекомендовано редакционно-издательским советом  
Омского государственного технического университета*

ISBN 978-5-8149-2506-0

© ОмГТУ, 2017